

半导体参数分析仪

所属学校:重庆大学

仪器基本信息			仪 器 编 号		06012076			
			仪器英文名称		Semiconductor Parameter Analyzer			
			所属校内单位		光电工程学院			
			放 置 地 点		A 区微系统研究中心			
			仪器负责人		梁玉前	制造商国别	美国	
			制 造 厂 商		安捷伦科技有限公司			
			规 格 型 号		4156C			
			仪 器 原 值		46.44 万元	购置日期	2006.3	
仪器性能信息	主要技术指标	4x 也没分辨率 SMU、2xVSU 和 2xVMU;1fA 和 0.2mV 测量分辨率;QSCV、强化测试模式、旋钮扫描和待机功能。						
	主要功能及特色	仪器可用于半导体芯片,器件的微电流,电容等参数的测试。						
相关科研信息	主要研究方向	本设备是专门用于半导体参数测试的仪器,可以用于 fA 量级的微弱电流的测试,还可以用于准静态 C - V 的测试。						
	在研或曾承担的重大项目	二维加速度计、基于连续紫外光谱分析的工业水污染监测微系统、基于连续光谱分析的全自动微小型生化分析仪、集成低电压电泳生化分析系统芯片。						
	学术 论文	近三年利用该仪器作为主要科研手段发表的代表性论文:						
		序号	作者	论文题目	期刊名称	年	卷(期)	起止页
		1	刘海涛、温志渝	低电压电泳芯片非接触电导检测电路设计	光学精密工程	2009	17(7)	1640 - 1645
		2	向贤毅、温志渝	用于近红外光谱仪的平场全息凹面光栅的模拟与设计	光谱学与光谱分析	2008	28(7)	1670 - 1673
专利或奖项								
共享服务信息	收费标准	联盟外	100 元/样片					
		联盟内	80 元/样片					
	联系信息	联系人	梁玉前	联系电话	65102519	电子邮件	lyuqian@cqu.edu.cn	
	开放时间	提前预约						